

Constraint-based hierarchical untestability identification for synchronous sequential circuits

Raik, Jaan; Rannaste, Anna; Jenihhin, Maksim; Viilukas, Taavi; Ubar, Raimund-Johannes; Fujiwara, Hideo Sixteenth IEEE European Test Symposium : 23-27 May 2011, Trondheim 2011 / p. 147-152

Constraint-based hierarchical untestability identification for synchronous sequential circuits

Viilukas, Taavi; Raik, Jaan; Ubar, Raimund-Johannes; Rannaste, Anna; Jenihhin, Maksim; Fujiwara, Hideo Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikooli IKTDK viienda aastakonverentsi artiklite kogumik : 25.-26. novembril 2011, Nelijärve 2011 / p. 139-142 : ill

Hierarchical test pattern generation and untestability identification techniques for synchronous sequential circuits = Hierarhilised testintegreerimise ja mittetestitavuse identifitseerimise meetodid sünkroonsetele järjestiksskeemidele

Rannaste, Anna 2010 https://www.ester.ee/record=b2637391*est

Hierarhilisest testigeneerimisest ja mittetestitavuse analüüsist

Rannaste, Anna A & A 2010 / 4, lk. 38-39 https://artiklid.elnet.ee/record=b2286481*est